

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR-Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Produkt **#90-483** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€8.100⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€8.100,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Modellnummer:	
LCPLN50XIR	
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):	
Focal Length: 180mm	
Typ:	
Microscope Objective	
Art:	
Infinity Corrected	

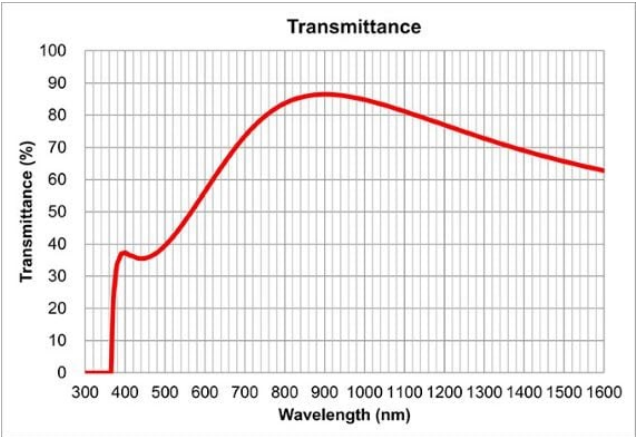
Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.44	Bildfeld (mm):
40.50	Länge ohne Gewinde (mm):
31.00	Max. Durchmesser (mm):
169	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
Glass: 0 - 1.2mm Silicon: 0 - 1.2mm	Kompatible Deckglasdicke (mm):
3.60	Brennweite BW (mm):
50X	Vergrößerung:
0.65	Numerische Apertur NA:
0.52	Auflösung (µm):
0.65	Tiefenschärfe (µm):
Glass: 4.50 - 3.76mm Silicon: 4.50 - 4.20mm	Arbeitsabstand (mm):
400 - 1600	Wellenlängenbereich (nm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
- Korrekturing zur Anpassung an die Probendicke
- Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubuslinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturing, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

Technische Informationen



LCPLN50XIR Transmission Graph

